

# SEMセミナー2023



開催日：令和5年12月12日（火） 場所：八戸インテリジェントプラザ アイピーホール

## 【座学】

電子顕微鏡の基本を学べます。

13:30～14:30

### SEMで何ができるのか

～走査電子顕微鏡の基礎と応用～

講師：日本電子(株) EPアプリケーション部 SEMグループ 山本 康晶 氏

## 【座学】

試料作成の基本を学べます。

14:30～15:00

### SEM用試料作製のコツ

～良いデータは試料作製から～

講師：日本電子(株) EPアプリケーション部 SEMグループ 山本 康晶 氏

## 休憩（10分）

## 【web 座学】

蛍光X線分析の基本を学べます。

15:10～15:30

### XRF（蛍光X線分析装置）でできることのご紹介

～材料分析から異物分析まで～

講師：日本電子(株) SA 技術開発部 村谷 直紀 氏

## 【実演】

実機の動きを確認できます。



15:30～17:00（各30分）

### ・JSM-7600F による試料観察

説明：(株)八戸インテリジェントプラザ 林崎公彦

### ・JCM-7000（卓上SEM）による試料観察

説明：日本電子(株) SI 販促部 野村朋子 氏

### ・JSX-1000S（蛍光X線分析装置）による試料分析

説明：日本電子(株) SA 技術開発部 村谷 直紀 氏

貴社（機関）名

（発信者氏名：

TEL

-

)

定員 15 名  
受講料無料  
申込締切 12/5

参加者 所属・氏名	E-mail

FAX 0178-21-2119

Mail hayashizaki@hachinohe-ip.co.jp

ファックスやメールの誤送信にお気をつけ下さい。

【お問い合わせ先】

八戸インテリジェントプラザ  
八戸市北インター工業団地 1-4-43  
TEL 0178-21-2111